



## WKL-702 颗粒图像分析仪

### 【产品特点】

WKL-702 颗粒图像分析仪将传统的显微测量方法与现代的图像技术相结合，是一种采用图像法进行颗粒形貌分析和粒度测量的颗粒分析系统，由光学显微镜、数字 CCD 摄像机和颗粒图像处理分析软件组成。该系统通过专用的数字摄像机将显微镜的颗粒图像拍摄下来传输给电脑，通过专用的颗粒图像处理分析软件对图像进行处理分析，具有直观、形象、准确和测试范围宽等特点。可以观察颗粒形貌，也可得到粒度分布等分析结果。

### 【技术参数】

	WKL-702
测量范围	1 ~ 3000 微米
最大光学放大倍数	1600 倍
最大分辨率	0.1 微米/像素
准确性误差	< ±3%(国家标准物质)
重复性偏差	< ±3%(国家标准物质)
数据输出	周长分布、面积分布、长径分布、短径分布、周长相当径分布、面积相当径分布、Feret 径分布、长短径比、中间 (D50)、有效粒径 (D10)、限定粒径 (D60、D30、D97)、个数长度平均径、个数面积平均径、个数体积平均径、长度面积平均径、长度体积平均径、面积体积平均径、不均匀系数、曲率系数。

### 配置参数 (配置 1 国产显微镜) (配置 2 进口显微镜)

三目生物显微镜:平场目镜: 10×、16×

消色差物镜: 4×、10×、40×、100× (油)

总放大倍数: 40×-1600×

摄像机: 300 万像素数字 CCD (标准 C 接口镜头)

### 【应用范围】

适用于磨料、涂料、非金属矿、化学试剂、粉尘、填料等各种粉末颗粒的粒度测量、形貌观察和分析。

# 软件功能及报告输出格式

- 1、可以对图像进行多项处理:如:影像增强、图像叠加、局部提取、定向放大、对比度、亮度调节等几十种功能。
- 2、具有圆度、曲线、周长、面积、直径等几十种几何参数的基本测量。
- 3、可直接按颗粒粒径的粒径面积、形状等多类参数，以线性或非线性统计方式绘出分布图



